



Comité d'organisation

J.F. FONTAINE
F. HENNEBELLE
D. JOANNIC
F. MAIRESSE
T. SLIWA
Y. VOISIN
Le2i - UMR 6306
Université de Bourgogne



J.J. ORTEU
Institut Clément Ader
Mines Albi



ANNONCE ET APPEL A COMMUNICATIONS

JOURNEE MESURE DIMENSIONNELLE PAR VISION

mercredi 9 avril 2014 - Amphi Saphir - Telecom PARISTECH

<http://gdr-isis.fr/index.php?page=reunion&idreunion=218>

Introduction

La journée technique **mesure dimensionnelle par vision** a pour but de rapprocher les communautés scientifiques portées sur l'acquisition et le traitement d'images ou de données 3D issues de capteurs optiques avec celles portées vers la mesure. Le besoin d'un tel rapprochement paraît d'autant plus indispensable que, contrairement à d'autres technologies, les utilisateurs se retrouvent confrontés à une absence de qualifications et de normes métrologiques.

Cette journée technique, 3^{ème} du nom, est organisée en partenariat avec le **GdR ISIS**, le **Club EEA**¹, le **CFM**², le **réseau Mesure, Modèles et Incertitudes**³ du CNRS et sous le patronage du **Club CMOI**⁴.

Description

La mesure par vision est en plein essor depuis de nombreuses années. Par vision, est entendu ici tout dispositif incluant un capteur image. Il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs et méthodes permettant d'acquérir la position, la taille, les paramètres de forme et d'états de surface. Néanmoins, tandis que le contrôle qualité par vision artificielle a atteint une certaine maturité, il n'en est pas de même pour le contrôle métrologique par vision.

Cette nouvelle journée vise à explorer les mesures dimensionnelles dans leurs divers contextes applicatifs et à faire échanger les communautés scientifiques sur les aspects métrologiques associés.

Programme

Présentations académiques et industrielles, scientifiques dans tous les cas, seront alternées (20 minutes + 5 de questions), avec des domaines d'applications variés : mesure industrielle, mesure médicale, mesure de champs de déformation, mesure à haute température ... Les travaux présentés doivent, à défaut de prétention métrologique, au minimum chercher à améliorer l'objectivité de la caractérisation, de l'identification, de l'extraction et de la mesure des éléments étudiés.

Inscription et Soumission

Inscription gratuite. Date limite de soumission : **14 février 2014**.

Contact : mesure-vision@u-bourgogne.fr

ⁱJMV précédentes : <http://gdr-isis.fr/index.php?page=reunion&idreunion=178>
<http://gdr-isis.fr/index.php?page=reunion&idreunion=106>

- 1 <http://www.clubeea.org/>
- 2 <http://www.cfmetrologie.com/>
- 3 <http://metrologie.cnrs.fr/>
- 4 <http://www.club-cmoi.fr/>